**Шишкин Дмитрий Сергеевич. Разработка и исследование количественного и структурного контроля материалов методами спектрального анализа : Дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 : Владимир, 2005 223 c. РГБ ОД, 61:05-5/2242**